



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

## ФАКУЛТЕТЕН СЕМИНАР

понеделник, 30.05.2016 г., 17:15 ч., зала А315

**проф. дфзн Стоян Русев**

кат. „Физика на твърдото тяло и микроелектрониката“

### **Елипсометрия – метод за изследване и характеризирание на материали и структури**

Елипсометрията е експериментален метод, който характеризира измервания образец чрез определяне на изменението на поляризацията на светлината при взаимодействие с него. Методът намира широко приложение в различни области на науката и техниката – физика, микроелектроника, материалознание и нанотехнологии, биология, медицина и др.

Ще бъдат представени оригинални резултати и изследвания в областта на елипсометрията – разработка и построяване на елипсометрична апаратура, нови подходи и решения, свързани с обратната елипсометрична задача и някои приложения на елипсометрията за изследване на твърдотелни структури и процеси на течни повърхности. Ще бъде разгледана възможността за съчетаване на предимствата на два мощни метода – чувствителността на елипсометрия в напречна посока и добрата странична разделителна способност на сканиращата електронна микроскопия.